

## 2021 年新春電子顕微鏡解析技術フォーラムのお知らせ

公益社団法人 日本顕微鏡学会・電子顕微鏡解析技術分科会  
責任者 丸山 秀夫  
実行委員長 白井 学

日本顕微鏡学会・電子顕微鏡解析技術分科会では、機能性材料や電子デバイスの評価に関する身近な疑問点をざっくばらんに話し合う場として「電子顕微鏡解析技術フォーラム」を開催しております。

本フォーラムでは、例年、参加者が会場に集まり Face to Face での議論を行ってありますが、今年度は新型コロナ感染拡大防止対策として、オンラインで開催します。

今回のテーマは「工夫をすればここまで見える～電子線ダメージに打ち勝つ方法～」と題し、電子顕微鏡観察を行う際に誰もが頭を悩ませる試料の電子線損傷について取り上げます。

各分野のエキスパートの方々より、様々な材料や観察シチュエーションにおける実例をもとに、電子線が試料に与える影響、観察における注意点、ダメージ軽減方法など、様々な視点からのご講演を頂く予定です。参加者の皆様の日頃の電顕業務に生かせるノウハウや課題解決の糸口が得られる場となれば幸いです。

今回、このフォーラムの特色である“ざっくばらんトーク”はありませんが、講演内容に関して参加者の皆様からの質問をいただきながら、活発な議論ができればと思っております。

電子顕微鏡に携わる皆様、ふるってご参加ください！

### 記

1. 主催：公益社団法人 日本顕微鏡学会・電子顕微鏡解析技術分科会
2. 日時：2021年1月22日（金）13:00～16:15  
開催形式：オンライン開催（web 会議システム Teams）  
参加費：無料
3. 定員：100名
4. 申し込み期間：12月初旬～1月15日（定員になり次第締め切ります）。  
申し込み方法：電子顕微鏡解析技術フォーラムの HP のリンクもしくは QR コードから登録をお願いします。

### 問い合わせ先：

日鉄テクノロジー（株） 水尾 有里 e-mail: mizuo.yuri.8dg@nstec.nipponsteel.com  
電話：0439-80-2866 ファクシミリ：0439-80-2733  
HP：<http://www.em-forum.sakura.ne.jp/>

5. 主な内容：講演のアブストラクトを当フォーラムのHP（上記）で公開しています。

- ・電子照射に伴うセラミックスの微細構造変化：格子励起/電子励起効果  
安田 和弘(九州大学)
- ・メルビル製 試料冷却システムを用いた顕微鏡観察例の紹介  
宮崎 裕也(株式会社メルビル)
- ・東レリサーチセンターでの電子線脆弱材料解析への取り組み  
杉山 直之(株式会社東レリサーチセンター)
- ・ETEM 観察における電子線照射の影響  
吉田 秀人(大阪大学)

### 〈電子顕微鏡解析技術フォーラム実行委員〉

丸山 秀夫(ナテック)、石丸 雅大(サモフィツォサイエティック)、石本 竜二(トクヤマ)、乾 光隆(セイコーエプソン)、遠藤 徳明(日本電子)、木村 耕輔(東レリサーチセンター)、工藤 修一(マクサ)、志摩 会実佳(東芝アナリティクス)、白井 学(日立ハイテクノロジーズ)、高橋 知里(産総研)、長澤 忠広(ライマイトシステム)、水尾 有里(日鉄テクノロジー)、宮澤 知孝(東京工業大学)、武藤 俊介(名古屋大学)、村上 和歌子(リコー)、吉田 誠(旭化成)、和田 充弘(三井金属)